

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АН СССР
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 36

А.М.Власов, В.А.Кабанник, Г.А.Корнюхин

С.В.Кротов, В.И.Кузнецов

ДВУХКРИСТАЛЬНЫЙ МОНОХРОМАТОР,
УПРАВЛЯЕМЫЙ ОТ ЭВМ ДЛЯ ЭКСПЕРИ-
МЕНТОВ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ ЯДЕРНЫХ
УРОВНЕЙ ИЗОТОПОВ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРЕПРИНТ 80 - 204



Новосибирск

А.М.Власов, В.А.Кабаник, Г.А.Корюхин,
С.В.Кротов, В.И.Кузнецов.

ДВУХКРИСТАЛЬНЫЙ МОНОХРОМАТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ОТ ЭВМ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ ЯДЕРНЫХ УРОВНЕЙ
ИЗОТОПОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А Н Н О Т А Ц И Я

В данной статье описывается двухосный двухкристальный монохроматор, управляемый от ЭВМ. Монохроматор предназначен для предварительной монохроматизации в экспериментах по возбуждению низколежащих Мессбауэровских уровней с помощью синхротронного излучения. Рассматриваются различные схемы монохроматизации и выбор кристаллов для увеличения энергетического разрешения монохроматора и увеличения приемных углов входных кристаллов-монохроматоров. Проведены измерения на различных типах кремниевых и германиевых кристаллов. Приверена температурная стабильность монохроматора на пучке СИ от накопителя ВЭШ-3 и пучке СИ от сверхпроводящей "змейки".

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей статье описывается двухосный двухкристальный рентгеновский монохроматор, управляемый от ЭВМ. Монохроматор предназначен для предварительной монохроматизации рентгеновского пучка в экспериментах по возбуждению низколежащих мессбауэровских уровней ядер. Источником излучения в этих экспериментах служит синхротронное излучение накопителей и сверхпроводящих "змеек" [1]. Пучок СИ обладает конечной угловой расходимостью, поэтому возникает задача максимально использовать вертикальную расходимость пучка за счет увеличения приемных углов входного кристалла - монохроматора. Эта проблема решается кристаллами с малыми коэффициентами асимметрии ($B \ll I$). Для уменьшения тепловых нагрузок на единицу рабочей поверхности входного кристалла - монохроматора выгодно уменьшить коэффициент асимметрии, что приведет к увеличению проекции пучка СИ на поверхности кристалла.

Требование уменьшения фона, возникающего вследствие конечной ширины линии пропускаемой монохроматором и, приводящей к появлению когерентного и некогерентного нерезонансного рассеяния фотонов вызывает необходимость предельно увеличивать энергетическое разрешение монохроматора. Некоторыми возможными путями увеличения разрешения являются применение асимметричной дифракции по Брэггу, использование многократного отражения, выбор более совершенных слабопоглощающих кристаллов кремния [2].

Преимущества данного типа монохроматора по сравнению с описанным в работе [1] монохроматором, в котором были выбраны плоские со слабой асимметрией германиевые кристаллы, состоят в увеличении энергетического разрешения, уменьшении диффузного фона от выбранных кремниевых кристаллов, увеличении приемных углов, уменьшении тепловых нагрузок на единицу поверхности входного кристалла. В монохроматоре реализуется ряд схем симметричного и асимметричного отражения по Брэггу, в которых кристаллы расположены в нулевой дисперсии ($D=0$) и в положении с максимальной дисперсией (D_{max}).

Промежуточным этапом в экспериментах по возбуждению мессбауэровского уровня ^{57}Fe пучком СИ является настройка моно-

хроматора на резонансную длину волн ($\lambda_r = 0.86 \text{ \AA}$) на радиоактивном источнике ^{57}Co . В этом случае, разумное время точной настройки на λ_r связано с выбором определенного типа кристаллов. На данном монохроматоре были проверены кремниевые и германиевые кристаллы вырезанные вдоль плоскостей (III), (3II) с сильной ($B = 0.07$) и слабой ($B = 0.98$) асимметрией. Измерение основных характеристик монохроматора с различными типами кристаллов проводилось на молибденовой трубке БСВ-10, на радиоактивном источнике ^{57}Co , на пучке СИ накопителя ВЭШ-3 и пучке СИ от сверхпроводящей "змейки".

Конструкция монохроматора

Схема двухкристального монохроматора представлена в двух проекциях на рис.1. Общий вид показан на рис.2. Первый кристаллодержатель устанавливается в центре диска (9), имеющего ось (14). Ось (14) вместе с диском вращается при помощи рычага (13) во втулке, укрепленной в центре фланца (II). Второй кристаллодержатель устанавливается на фланце (4), имеющим ось (15). Ось (15) вместе с фланцем (10) вращается при помощи рычага (12) во втулке, укрепленной в диске (9). Рычаги приводятся в движение механизмами привода (7,8). Механизм привода (8), вращающий 1-й кристалл, крепится с помощью кронштейна (5) к фланцу (II). Механизм привода (7), вращающий 2-й кристалл, крепится с помощью кронштейна (6) к диску (9) и вращается вместе с ним. Характерной особенностью данного монохроматора является то, что при $a=b$ (см.рис.3), получение отражения от двух кристаллов осуществляется в два приема: а) получение отражения от 1-го кристалла путем поворота диска вокруг оси O_1 , б) получение отражения от 2-го кристалла путем поворота фланца вокруг оси O_2 . Этот процесс представлен на рис.3. Отличительной особенностью данной схемы монохроматизации является то, что при определенном угле между кристаллами из сплошного спектра рентгеновского излучения выделяется фиксированная длина волны λ . Принципиальная конструкция механизма привода показана на рис.4. В данной конструкции механизма привода было сочтено необходимым отказаться от традиционного типа подпружинивания рычага и ввести скользящую пружину (16). Это сделано с целью разгрузки ходовой гайки (6)

от дополнительных усилий, вызванных подпружиниванием, и, как следствие, от дополнительного износа резьбы. Техническая характеристика механизма привода:

1. Шаг двигателя ШДА-ЗФМ: $11^{\circ}15'$.
2. Частота шагов: 200 Гц
3. Шаг винта: 0.25 мм
4. Передаточное отношение редуктора: 1/137
5. Диапазон перемещения гайки: ± 90 мм
6. Перемещение гайки за 1 шаг двигателя: 0.6 мк

Применение описанного механизма привода, а также точное изготовление и плотная притирка всех деталей, определяющих точность монохроматора позволяют ему иметь следующие характеристики: 1. поворот кристаллов за один шаг двигателя: $0.^{\circ}06$, 2. диапазон поворота кристаллов: $\pm 24^{\circ}$, 3. точность возвращения кристаллов в исходное положение после поворота на максимальный угол (24°): $0.^{\circ}6$.

Различные варианты монохроматизации рентгеновского пучка и выбор кристаллов для двухкристального монохроматора

В случае монохроматизации пучка СИ, обладающего непрерывным распределением спектра по длинам волн, кристаллом-монохроматором при выполнении условия Брэгга выделяются, кроме основной длины волны, следующие порядки длин волн λ_n , дифрагирующие от соответствующих порядков по d_{hkl} . С одной стороны, гармоники в спектре отражения от кристаллов являются хорошими реперами при калибровке по энергии, с другой, вклад гармоник сильно искачет полученнную информацию в ряде экспериментов, поэтому возникает необходимость избавится от них. Для ясности последующего изложения выгодно привести некоторые формулы, полученные динамической теорией рентгеновской дифракции [3] для многократного отражения по Брэггу от центросимметричных поглощающих кремниевых и германиевых кристаллов. Эти формулы позволяют оценить величину угловых сдвигов гармоник от точного значения кинематического угла Брэгга- ϑ_b , построить профили кривых дифракционного отражения с учетом поправок на аномальное поглощение и из анализа

построенных кривых выбрать наиболее оптимальные кристаллы для высокоразрешающего двухкристального монохроматора. В приближении плоской волны область полного отражения от идеально-го кристалла записывается в виде [4] :

$$R = E - \sqrt{E^2 - 1} \quad (I.1)$$

$$E = \frac{1}{1+k^2} \left\{ Y^2 + g^2 + \sqrt{(Y^2 - g^2 - 1 + k^2)^2 + 4(gY - k)^2} \right\}$$

$$Y = \frac{\frac{1}{2}(1+\beta) \cdot \chi_0' + \beta(\vartheta_0 - \vartheta_b) \cdot \sin 2\vartheta_b}{P \cdot \sqrt{\beta} \cdot |\chi_h''|} \quad (I.2)$$

$$g = \frac{(1+\beta) \cdot \chi_0''}{2 \cdot P \cdot \sqrt{\beta} \cdot |\chi_h'|}$$

$$\beta = \frac{\sin(\vartheta_b - \alpha)}{\sin(\vartheta_b + \alpha)}$$

$$k = \frac{\chi_h''}{\chi_h'}$$

Y - параметр определяющий величину углового отклонения пучка от условия Брэгга; ϑ_0 - угол между падающим пучком и плоскостью дифракции; ϑ_b - кинематический угол Брэгга; β - коэффициент асимметрии; P - поляризационный фактор; α - угол между внешней плоскостью кристалла и дифрагирующей плоскостью; χ_h' и χ_h'' - реальная и мнимая части h -Фурье комп. поляризуемости.

На рис.5 и 6 построены кривые дифракционного отражения для кремниевых и германиевых кристаллов от плоскости (220) на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$. Из рис.5 и 6 видно, что наиболее сильная асимметрия кривой дифракционного отражения наблюдается для кристаллов германия, обладающих большим коэффициентом поглощения ($\mu = 491.4 \text{ см}^{-1}$), по сравнению со слабопоглощающими кристаллами кремния ($\mu = 26.6 \text{ см}^{-1}$). Вследствие рефракции центры симметрии дифракционных максимумов гармоник λ_n сильнее сдвинуты относительно λ_0 у германия, по сравнению с кристаллами кремния. Т.о. для избавления от паразитных гармоник, появ-

ляющихся из спектра СИ выгодно использовать германиевые кристаллы, которые обладают относительно большими угловыми сдвигами. При асимметричной дифракции по Брэггу можно достичнуть значительно большего сдвига гармоник относительно центра симметрии основной гармоники λ_0 , используя косые срезы, подобирая соответствующие коэффициенты асимметрии β . На рис.7 построены кривые дифракционного максимума для Ge (220) на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$ ($\beta = 0.038$, $\alpha = 11^\circ 5$). Видно, что наряду с уширением дифракционного максимума сильно сдвигаются положения центров гармоник λ_n . Это позволяет сравнительно легко избавится от них прибегая к методу последовательных отражений, комбинируя в схеме различными типами кристаллов (например Ge, Si) [2].

Для многократного отражения по Брэггу полная мощность излучения, отраженная от n -кристалла, как функция вертикального угла поворота β (горизонтальная расходимость пучка заключена в пределах $[\zeta_1, \zeta_2]$), записывается выражением вида:

$$P_n(\beta) = \int_{\psi_1}^{\psi_2} \int_{\zeta_1}^{\zeta_2} \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} N(\lambda, \zeta, \psi) \cdot R_0 \left[\zeta - \frac{1}{2} \psi^2 \cdot \operatorname{tg} \vartheta_b - (\lambda - \lambda_0) \frac{\partial \vartheta}{\partial \lambda} \right] \times \\ \times \prod_{j=1}^n R_j \left[\pm \beta \pm \zeta - \frac{1}{2} \psi^2 \cdot \operatorname{tg} \vartheta_b - (\lambda - \lambda_0) \frac{\partial \vartheta}{\partial \lambda} \right] d\psi \cdot d\zeta \cdot d\lambda \quad (I.3)$$

где $N(\lambda, \zeta, \psi)$ - функция спектрально-углового распределения потока фотонов рентгеновского источника, R_i , R_j - абс.коэф. отражения от первой и j -й плоскости кристалла, соответственно, ψ - вертикальная угловая расходимость источника СИ.

В случае многократного отражения по Брэггу в системе параллельных плоскостей моноблочного двойного кристалла-монохроматора выражение (I.5) упрощается и принимает вид:

$$P_n(0) = \int_{\psi_1}^{\psi_2} \int_{\zeta_1}^{\zeta_2} \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} N(\lambda, \zeta, \psi) \cdot \prod_{j=0}^n R_j \left[\zeta - \frac{1}{2} \psi^2 \cdot \operatorname{tg} \vartheta_b - (\lambda - \lambda_0) \frac{\partial \vartheta}{\partial \lambda} \right] \times \\ \times d\psi \cdot d\zeta \cdot d\lambda \quad (I.4)$$

На рис.8 и 9 проведены профили кривых дифракционных максимумов для одно, двух и трехкратного отражений от моноблоочных кремниевых и германиевых кристаллов (III) на длине волны $\lambda = 0.709 \text{ \AA}$. Из рис.8 и 9 видно, что многократное отражение сильно давит фон от хвостов кривой дифракционного максимума ($191 \geq 1$). Из проведенного анализа построенных кривых видно, что сильно поглощающие кристаллы германия при многократном отражении существенно уменьшают полную мощность рентгеновского пучка и заметно исказают форму дифракционного максимума. Поэтому, при выборе кристаллов, используемых в изготовлении монохроматоров для многократного отражения по Брэггу следует отдавать предпочтение совершенным, слабопоглощающим кристаллам кремния.

Существует ряд задач требующих, с одной стороны, предельно высокого энергетического разрешения и уменьшения угловой расходности, с другой, требуется увеличение светосилы монохроматора и увеличения $\Delta\lambda/\lambda$ [5-7]. В этом смысле, случай асимметричной дифракции по Брэггу рентгеновского пучка от совершенных кристаллов представляет особый интерес. На рис.10 показаны схемы расположения кристаллов с D_{max} и $D=0$, в которых реализуются поставленные условия, увеличения светосилы, с одной стороны, с другой - увеличение разрешения монохроматора. На рис.10 изображены диаграммы Дю Монда для каждого конкретного случая расположения кристаллов [8]. Пунктирной линией показана область полного отражения от второго кристалла. Заштрихованная область, образованная линиями угловых координат и длинами волн, определяет ширину линии и угловую расходимость пучка сформированную на выходе двухкристального монохроматора. Изменение угловой расходимости и размеров дифрагирующего рентгеновского пучка в пределах области полного отражения (ОПО) можно существенно менять, варьируя угол α - угол между входной поверхностью кристалла и плоскостью дифракции. Точность величины угла α задается шлифовкой с последующей полировкой и травлением поверхности кристалла. Угловая область в которой происходит полное отражение получается из выражения (I.2) при $-1 \leq u \leq 1$ и имеет вид, соответственно для кристаллов II и III (см. рис.12):

$$\Delta\vartheta_{II} = \frac{2 \cdot P \cdot |\chi_h'|}{\sqrt{\beta_1} \cdot \sin 2\vartheta_b} \quad (I.5)$$

$$и \quad \Delta\vartheta_{III} = \frac{2 \cdot P \cdot |\chi_h'| \cdot \sqrt{\beta_2}}{\sin 2\vartheta_b} \quad (I.6)$$

Подставляя выражение (I.5) в (I.6) получим:

$$\Delta\vartheta_{III} = \sqrt{\beta_1 \beta_2} \cdot \Delta\vartheta_{II} \quad (I.7)$$

Т.е. область полного отражения (ОПО) от двойного монохроматора, изображенного на рис.12 становится в $\sqrt{\beta_1 \beta_2}$ раз уже, чем для падающего пучка. Чтобы получить величину энергетического разрешения монохроматора достаточно продифференцировать уравнение Брэгга ($2 \cdot d_{hkl} \cdot \sin \vartheta_b = n \cdot \lambda$) при этом имеем:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{P \cdot |\chi_h'|}{\sqrt{\beta_1} \cdot \sin^2 \vartheta_b} \quad (I.8)$$

$$и \quad \frac{\Delta E}{E} = \frac{P \cdot |\chi_h'| \cdot \sqrt{\beta_2}}{\sin^2 \vartheta_b} \quad (I.9)$$

Соответственно подставляя (I.8) в (I.9) получим:

$$(\frac{\Delta E}{E})_{III} = \sqrt{\beta_1 \beta_2} \cdot (\frac{\Delta E}{E})_{II} \quad (I.10)$$

В таблице I и 2 приведены величины энергетических разрешений и угловые ШВ, рассчитанные с учетом поправок на аномальное поглощение для различных плоскостей кремниевых и германиевых кристаллов на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$ ($E_k = 14.4 \text{ КэВ}$), соответственно для σ и π поляризации падающего излучения.

На рис.11 изображен кристалл-поляризатор, вырезанный в плоскости (840) и обладающий сильной асимметрией ($\beta = 0.054$).

На длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$ при угле Брэгга близкого к 45° ($\vartheta_b = 45^\circ 09'$) происходит практически полное погасание \mathcal{R} - компоненты излучения. Применение данной конструкции монохроматора в ряде экспериментов может значительно понизить уровень фоновых загрузок (подавление комптоновского рассеяния).

На рис. I.2 показана схема расположения кристаллов в максимальной дисперсии, обладающая высоким разрешением и малой выходной угловой расходностью рентгеновского пучка. В этой схеме угол при котором происходит отражение от кристалла II, записывается выражением, полученным из угловой функции Y (I.2):

$$\vartheta_{\text{II}} = \vartheta_b + \delta_{\text{II}} + \xi_{\text{II}} \cdot Y \quad (\text{I.2})$$

где $\delta_{\text{II}} = (1 + \frac{1}{B_1}) \cdot \frac{|\chi'_0|}{2 \cdot \sin 2\vartheta_b}$, $\xi_{\text{II}} = \frac{1}{\sqrt{B_1}} \cdot \frac{P \cdot |\chi'_0|}{\sin 2\vartheta_b}$

Соответствующее выражение для угла падения, относящееся к кристаллу III, имеет вид:

$$\vartheta_{\text{III}} = \vartheta_b + \delta_{\text{III}} + \xi_{\text{III}} \cdot Y \quad (\text{I.12})$$

где $\delta_{\text{III}} = (1 + B_2) \frac{|\chi'_0|}{2 \cdot \sin 2\vartheta_b}$, $\xi_{\text{III}} = \sqrt{B_2} \frac{P \cdot |\chi'_0|}{2 \cdot \sin 2\vartheta_b}$

Вторые слагаемые в выражениях, соответствуют угловому сдвигу средней точки максимума, относительно кинематического угла Брэгга - ϑ_b , вследствие рефракционного эффекта. Третий слагаемые соответствуют отклонению падающего и дифрагированного пучков от середины угловой области полного отражения относительно нового начала координат в масштабе Y .

На схеме, представленной на рис. I.2 последовательно рассмотрим угловые положения центров δ_{II} , δ_{III} и значения ШВ ξ_{II} и ξ_{III} дифракционных максимумов от кристаллов II и III, относительно величины ϑ_b . Кремниевые кристаллы, вырезанные вдоль плоскости (III) с углом среза $\alpha = 5^\circ 53'$, расположены в схеме с максимальной дисперсией. Направление косых срезов задано в виде: $+\alpha_{\text{II}}$ и $-\alpha_{\text{III}}$. Из падающего пучка СИ на кристалл II с угловой расходностью Ψ_2 ($\Psi_2 = 36''$) эффективной для получения дифракционного максимума считается область ξ_{II} ($\xi_{\text{II}} = 10.''89$). Средняя точка которой смещена,

вследствие рефракции на величину $\delta_{\text{II}} \cdot \delta_1$, от угла ϑ_b . Кроме дифракционного пика от кристалла III формируемого в угловой области $\xi_{\text{III}} \cdot \delta_2$ возникает фоновое отражение в угловом интервале $\xi_{\text{II}} / \delta_2$ центр распределения которого смещен на величину $\delta_{\text{II}} \cdot \delta_2$ относительно ϑ_b .

Наложение области полного отражения и области фонового отражения приводит к образованию небольшого максимума, вследствие перекрывания хвостов угловых распределений. При этом угловые смещения дифракционного максимума и области фонового отражения равны $\delta_{\text{II}} \cdot \delta_1 \cdot \delta_2 - \delta_{\text{III}}$. Т.о. для того, чтобы совместить область дифракционного максимума первого кристалла (II) и область полного отражения (ОПО) второго кристалла (III) достаточно повернуть кристалл III на угол, соответствующий разности угловых отклонений от ϑ_b средних точек максимумов, получаемых от II и III кристаллов, т.е. величинн:

$$\Delta \delta_{\text{II}, \text{III}} = \delta_{\text{II}} \cdot \delta_1 - \delta_{\text{III}}$$

Для данного конкретного случая на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$ величинаворота кристалла III, вследствие углового смещения $\Delta \delta_{\text{II}, \text{III}}$ равна $1^\circ 24'$.

Описание работы и измерение основных характеристик монохроматора

В зависимости от условий эксперимента двухкристальный монохроматор может устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положениях. В измерениях на рентгеновской молибденовой трубке БСВ-10 двухкристальный монохроматор устанавливался на специальной подставке в осевом гнезде ГУР-5. В этом случае, различные варианты монохроматизации рентгеновского пучка проводились в схеме 3-х кристалльной дифракции (см.рис. I.3) [9,10]. В качестве первого исходного кристалла был выбран кремний (220) с угловой ШВ $\Delta\vartheta \approx 3''$ на MoK_{α_1} . После предварительной монохроматизации - выделении K_{α_1} , линии и проведении пучка через ось ГУР-5 устанавливался на специальной подставке двухкристальный монохроматор. При этом кристаллы II и III располагались вдоль одной плоскости прохо-

дящей через ось ГУР-5, расположенная рентгеновский пучок. Кристалл II находился на вертикальной оси ГУР-5. Отражение от кристалла II можно было получить двумя способами - вращая монохроматор как целое, применяя кинематику ГУР-5, а также, используя собственный шаговый привод монохроматора. Следующим шагом было вращение кристалла III вокруг оси с помощью ШД и получение дифракционного отражения. Для регистрации излучения использовался сцинтиляционный детектор ФЭУ-85 со спаренным счетчиком $\text{NaI}(\text{Te})$ размером $\phi 20 \times 1$ мм. На рис. I4, I5, I6 сравниваются "кривые качания" полученные от кристаллов Ge (III), Si (III) и Si (III) с косым срезом ($\alpha = 5.053$, $b = 0.079$) на линии MoK_{α_1} с рассчитанными кривыми дифракционного максимума для соответствующих плоскостей. Воспроизведимость положения дифракционного пика на длине волны MoK_{α_1} при отношении от начального значения на 12° определялась путем многократного повторения "кривых качания" исследуемых кристаллов и была не хуже 0.6 . При этом разрешающая способность монохроматора на Si кристаллах с $b = 0.081$ на длине волны MoK_{α_1} была $\sim 1.96 \cdot 10^4$. При настройке монохроматора на радиоактивном источнике ^{57}Co из спектра линий, возникающих при распаде ^{57}Co выделялась линия с энергией $E_\gamma = 14.4$ КэВ - энергия возбуждения ядерного перехода мессбаузеровского ядра ^{57}Fe . В качестве детектора использовался ФЭУ ДУР-56, со спаренным счетчиком $\text{NaI}(\text{Te})$ размером $\phi 20 \times 1$ мм. Сигнал с детектора через усилитель спектрометрического тракта "Лангр", подавался на вход БАП, затем сигнал с БАП считывался в ЗУ. Управление и выбор событий попадающих в окно БАП проводилось с помощью ЭВМ. Блок-схема шагового привода и внешних устройств, управляемых с помощью ЭВМ (ОДРА-1325) показана на рис. I7. Сканирование по углу с помощью ШД проводилось в режиме таймирования, используя счетчик-таймер, который управлялся сигналом от ЭВМ. Модули БУШД выполненные в стандарте "КАМАК" осуществляют шести и восемьтактную коммутацию обмоток ШД, в зависимости от числа фаз двигателя. Модуль БУШД имеет два режима работы от ЭВМ и ручной. При работе от ЭВМ направление и число шагов двигателя задается одной командой. Наибольшее число шагов двигателя задаваемое одной командой $\omega = 2^{13} - 1$. Для уменьшения времени выполнения команд на большое число шагов модуль

производит автоматическое увеличение частоты шагов двигателя в начале движения и уменьшение в конце движения. Число шагов, в течении которых происходит ускорение и замедление, может быть сделано равным 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Стартовая частота и частота ШД после ускорения устанавливается подстроичными резисторами в пределах 25-10000 Гц в зависимости от типа двигателя и параметров его нагрузки. В данных измерениях использовался двигатель РШД-ЗФМ с частотой 200 Гц. С целью уменьшения потребляемой мощности и мощности рассеиваемой в модуле и в двигателе, ток в обмотки подается в начале исполнения команды и отключается через время ~ 1 сек после ее выполнения.

Важным условием работы на пучке СИ является температурная стабильность двухкристального монохроматора, предварительно настроенного на ^{57}Co на резонансную длину волны $\lambda_r = 0.86 \text{ \AA}$. Вследствие большой мощности падающей на первый кристалл ($P = 1.88 \text{ вт/мм}^2$ на 2.2 ГэВ, $J = 100 \text{ мA}$) возникает необходимость исследовать поведение монохроматора при больших токах накопителя. С уменьшением угла падения на рабочую поверхность кристалла снижаются тепловые нагрузки на единицу площади. Т.о., чтобы уменьшить величину падающей мощности пучка СИ на ед. площади кристалла, выгодно уменьшать коэффициент асимметрии. При этом, рабочая поверхность монохроматора увеличивается пропорционально b^{-1} . После отражения от кристалла II (см. рис. I2) размер дифрагированного пучка увеличивается на величину b^{-1} следовательно, плотность падающего потока на ед. поверхности кристалла III во столько же раз уменьшается. На рис. I8 изображена схема, в которой проводились измерения тепловых уходов монохроматора. Отклоненный и монохроматизированный двухкристальным монохроматором пучок СИ коллимировался по горизонтали двойным моноблочным кремниевым кристаллом (220) с собственной угловой ШД на MoK_{α_1} , $\Delta\vartheta = 5''$.

В качестве анализатора использовался кристалл Si (220) (ШД $\text{MoK}_{\alpha_1}, \Delta\vartheta = 3''$). На рис. I9 показаны зависимости интенсивности дифрагированного пучка СИ, полученного из магнитной системы накопителя и пучка СИ из "змейки" ($E = 2.1 \text{ ГэВ}, H = 25 \text{ кГс}$) от величины тока электронов в накопителе ВЭПП-3. Линейная зависимость интенсивности от величины тока доказывает сохранение инт. коэффициентов отражений кремниевых кристаллов при данных гелий-

чинах тока электронов в накопителе. Измерение температурной стабильности монохроматора проводилось в режиме непрерывного облучения кристаллов, а также при периодическом выключении пучка СИ. На рис.20 изображена "кривая качания", полученная при вращении двухкристального монохроматора как целого, вокруг вертикальной оси кристалла П на пучке СИ, имеющего конечную вертикальную расходимость $\Psi_{\lambda} = 36''$ на длине падения волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$ при $\lambda_c = 3.22 \text{ \AA}$.

Обсуждение результатов

Измерение "кривых качания" различных типов кристаллов на двухкристальном монохроматоре в 3-х кристальной схеме с использованием ГУР-5 показано, что прибор соответствует поставленным к нему требованиям. Проведенные измерения на кремниевых кристаллах выявили точность воспроизводимости угловых значений равную $0.''6$ при сканировании по углу в пределах $\pm 12^{\circ}$.

В качестве средств дальнейшего повышения точности монохроматора следует указать, прежде всего, увеличение точности резьбы ходового винта и гайки (применение шлифовки), а также уменьшение люфтов в редукторе механизма привода. Дальнейшее повышение точности возможно при использовании более точного оборудования для изготовления деталей монохроматора, применении высокоточных методов контроля параметров деталей, применении материалов с малым коэффициентом линейного расширения и термостатировании монохроматора.

Использование кремниевых кристаллов с большой асимметрией ($B \ll I$) позволило, с одной стороны снять тепловые нагрузки на рабочей поверхности кристалла, за счет увеличения проекции пучка СИ, с другой стороны, наиболее эффективно использовать вертикальную угловую расходимость пучка СИ, улучшить энергетическое разрешение монохроматора и уменьшить диффузный фон от Si кристаллов. Требование увеличения энергетического разрешения монохроматора связано с выбором более совершенных, бездислокационных кристаллов и с наиболее тщательной их шлифовкой и травлением.

В заключении можно сказать, что оперативность в настройке на нужную длину волны, простота в эксплуатации и другие достоинства делают прибор удобным в экспериментах по возбуждению Мессбауэровских уровней ядер на пучке СИ.

Авторы выражают благодарность Скрипинскому А.Н., Кулпанову Г.Н., за внимание к работе, Артемьеву А.Н., Степанову Е.П., Чечину А.И., Казакову Ю.Н. за обсуждение результатов, Беловой Н.Е. за ряд высказанных замечаний, Ковригину Г.Л., Носкову А.Г., Ахметову В.Д. за приготовление кристаллов.

Л и т е р а т у р а :

1. A.N.Artemyev et al., Nucl. Instr. and Met. (1978), 152, 235-241.
2. V.Bouse. G.Materlik and W.Schröder. Preprint, DEZY SR-75/14, Hamburg (1975).
3. W.H.Zachariasen, Theory of X-ray Diffraction in Crystals, John Wiley Sons, Inc., New York, 1945.
4. M.Renninger. Acta Cryst. (1955) 8 597-606.
5. S.Kikuta, K.Kohra. J. Phys. Soc. Japan (1970) 29 (1322-1328).
6. J.H.Beaumont, M.Hart. J. Phys. E7 (1974), 823-829.
7. T.Matsusita. J. Appl. Cryst. (1974), 7, 254-259.
8. W.M. Du Mond Phys. Rev. (1937), 52, 872-883.
9. R. Bubáková. J.Drahokoupil, A. Fingerland Czech. J. Phys. (1961) B11, 199-222.
10. М.И.Гинзбург, В.А.Кабанник, В.И.Кузнецов, С.В.Кротов. Препринт 79-160. Новосибирск. ИЯФ СО АН СССР, 1979.

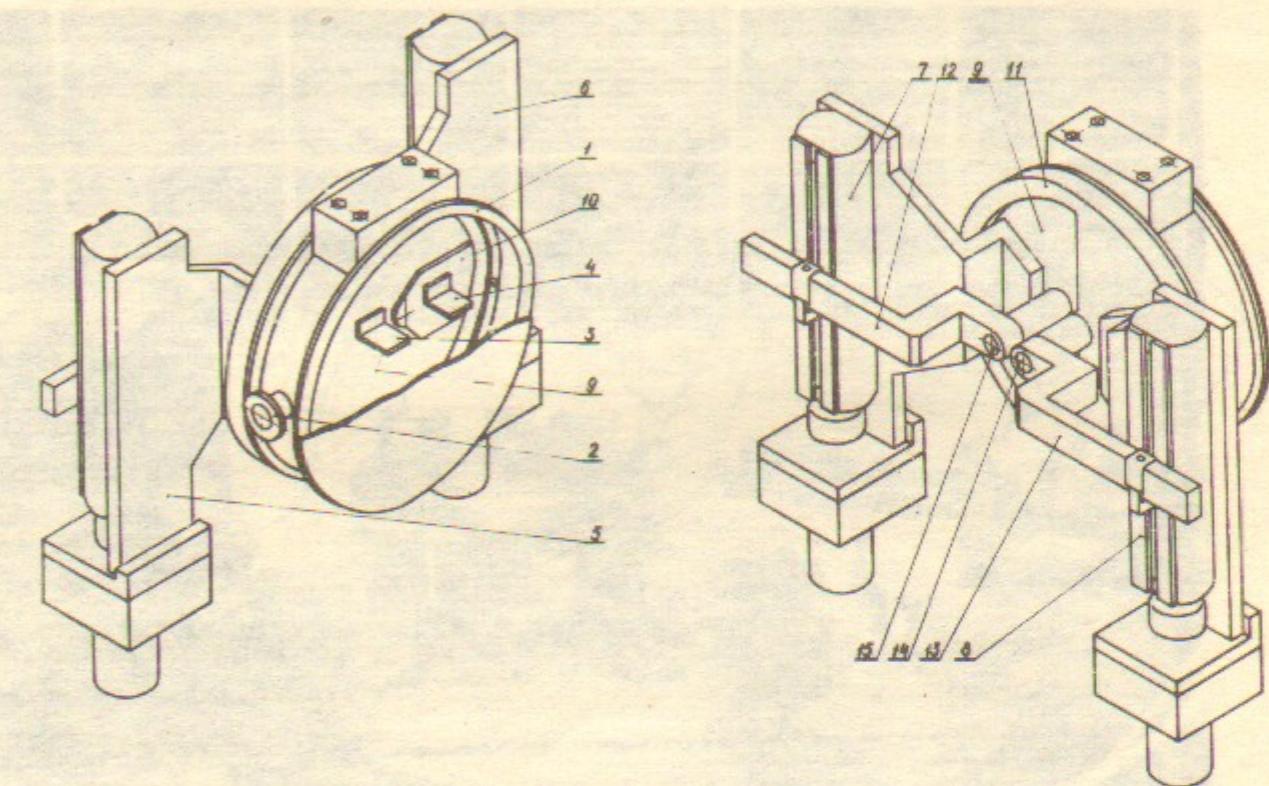


Рис. I. Схема двухкристального монохроматора
в двух проекциях.

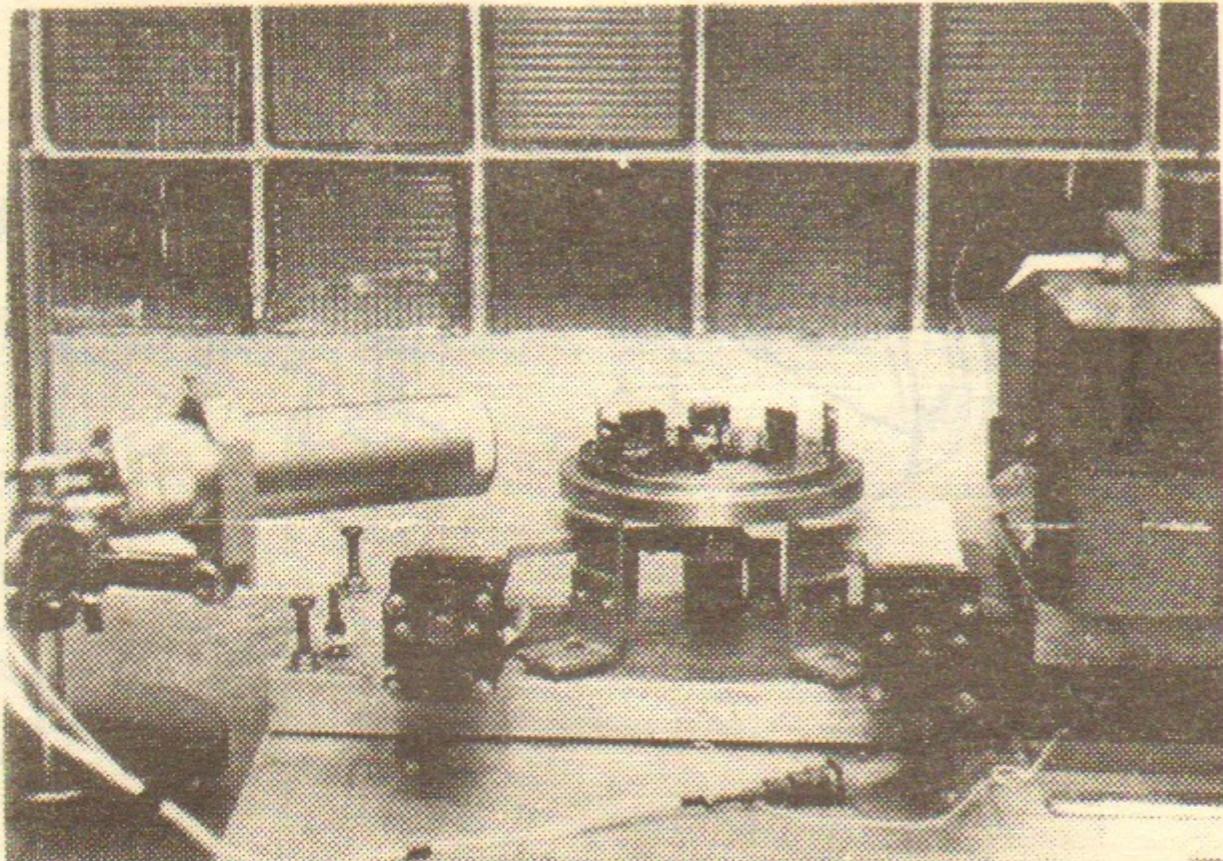


Рис.2. Общий вид двухкристального монохроматора при настройке на радиоактивном источнике ^{57}Co .

- 18 -

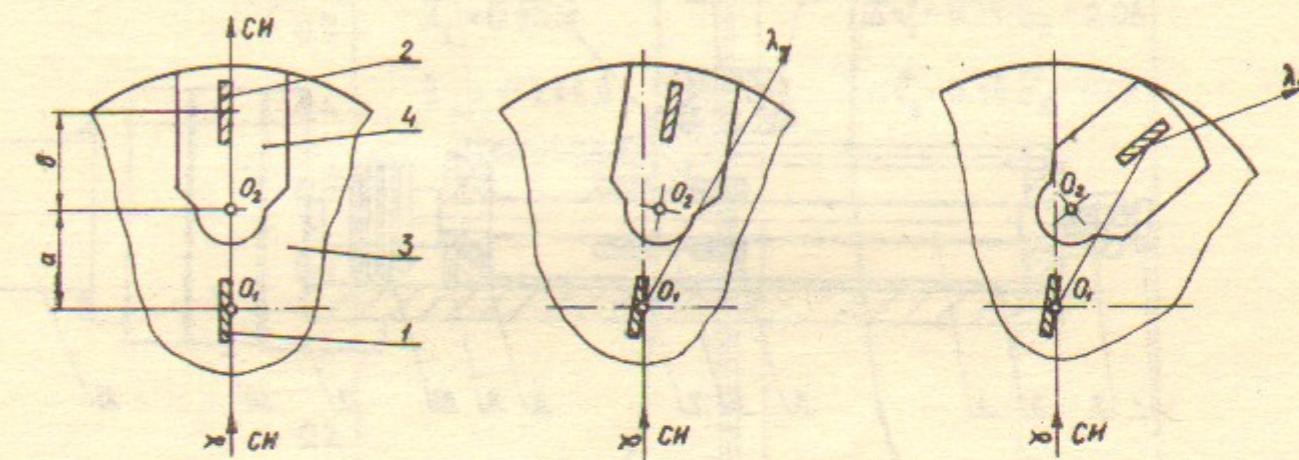


Рис.3. Схема последовательного получения отражений от кристаллов на двухкристальном монохроматоре.

- 19 -

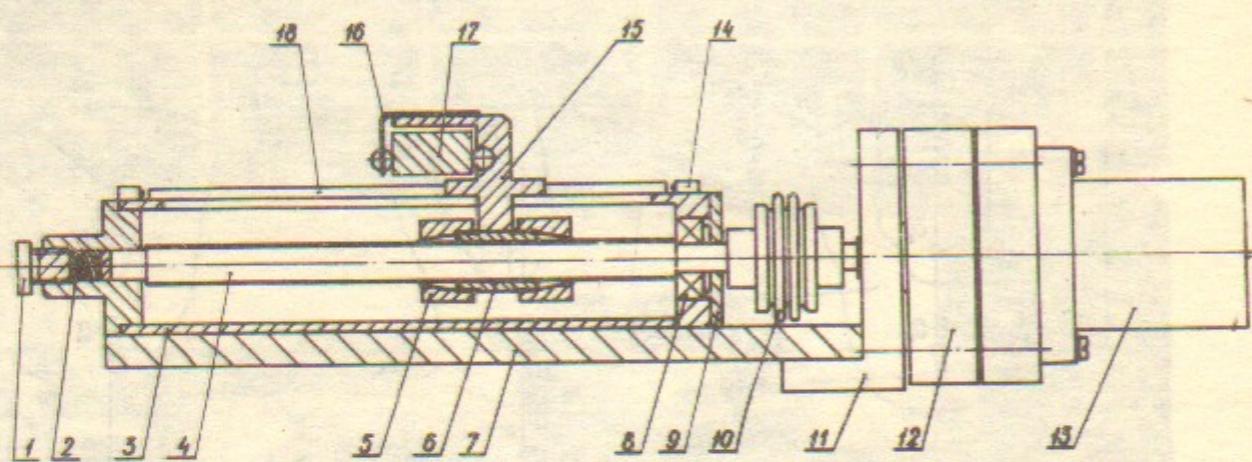


Рис.4. Механизм привода двухкристального монокроматора.

- 20 -

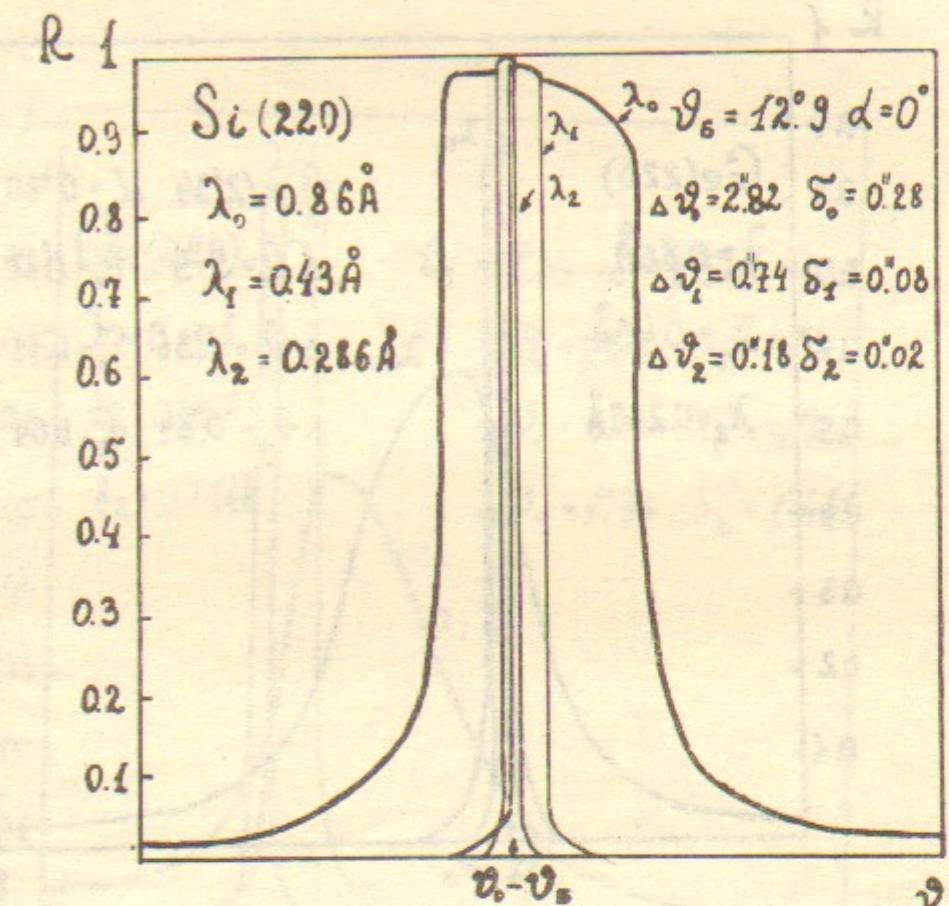


Рис.5. Кривые дифракционного максимума, полученные от кремниевого кристалла (220) для основной длины волны и следующих двух гармоник λ_n .

- 21 -

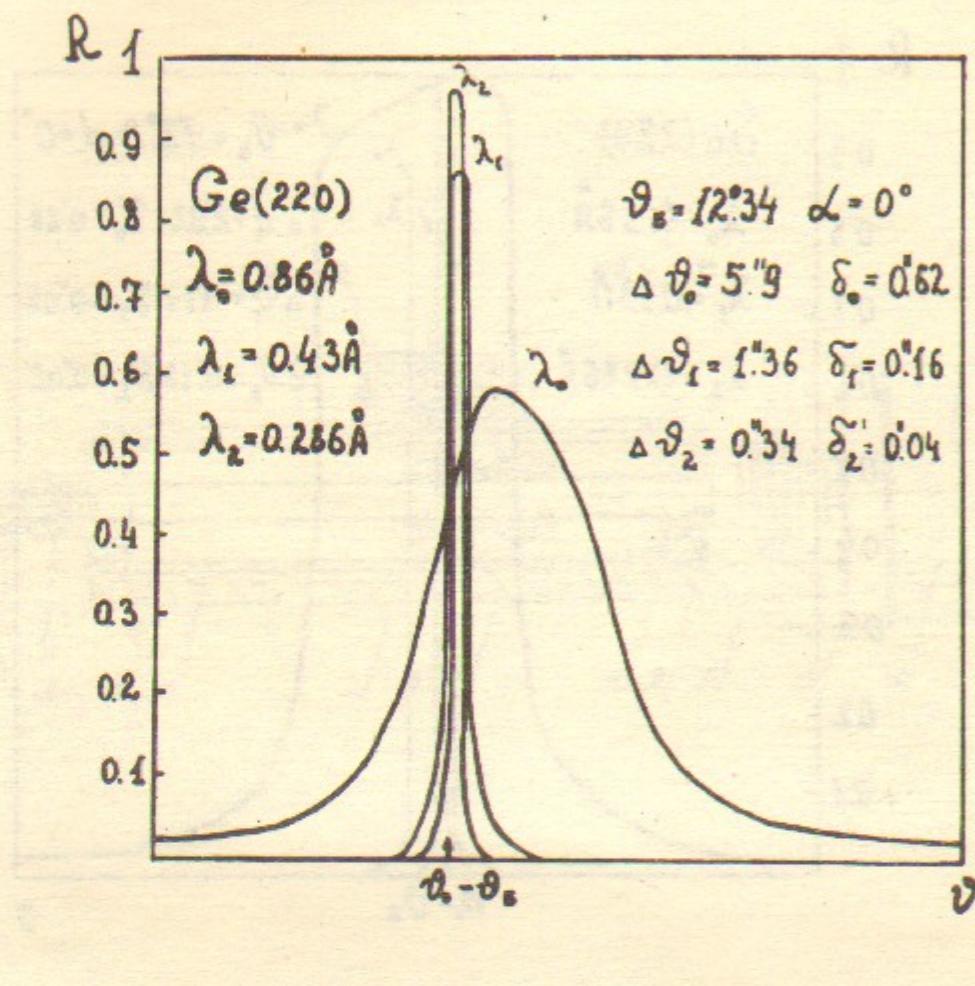


Рис.6. Кривые дифракционного максимума, полученные от германиевого кристалла (220) для основной длины волны и следующих двух гармоник.

- 22 -

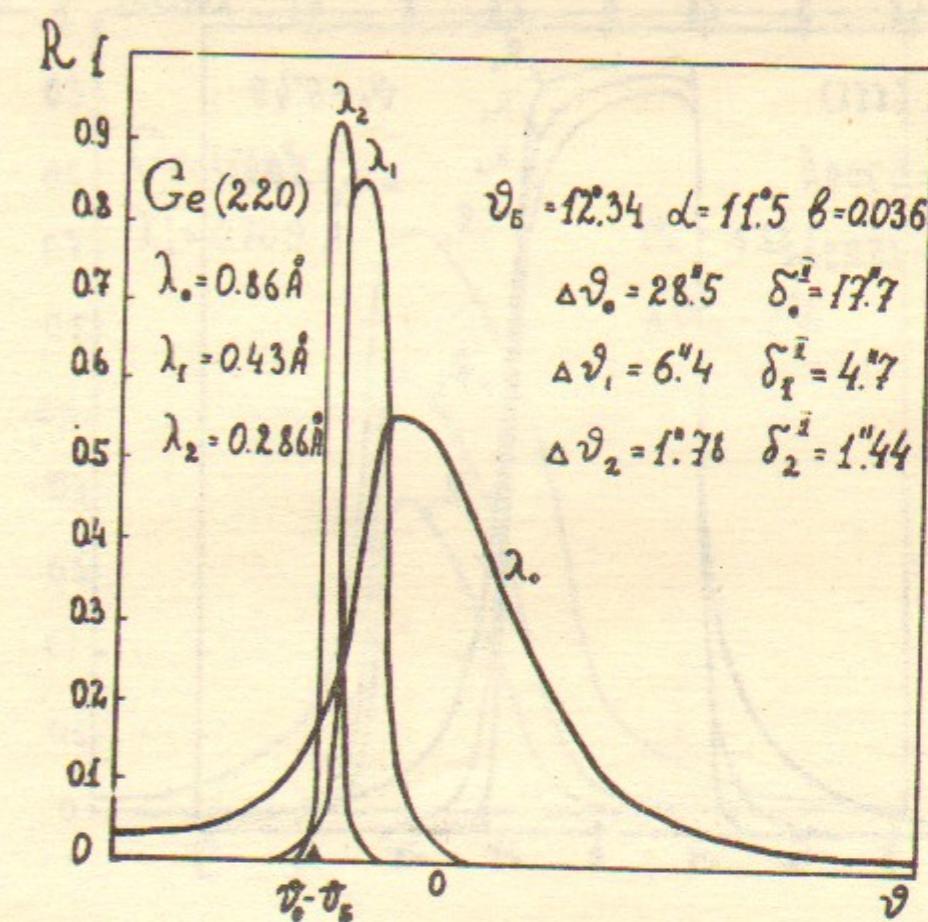


Рис.7. Кривые дифракционного максимума, полученные от германиевого кристалла (220) с сильной асимметрией для основной длины волны, первой и второй гармоник по λ .

- 23 -

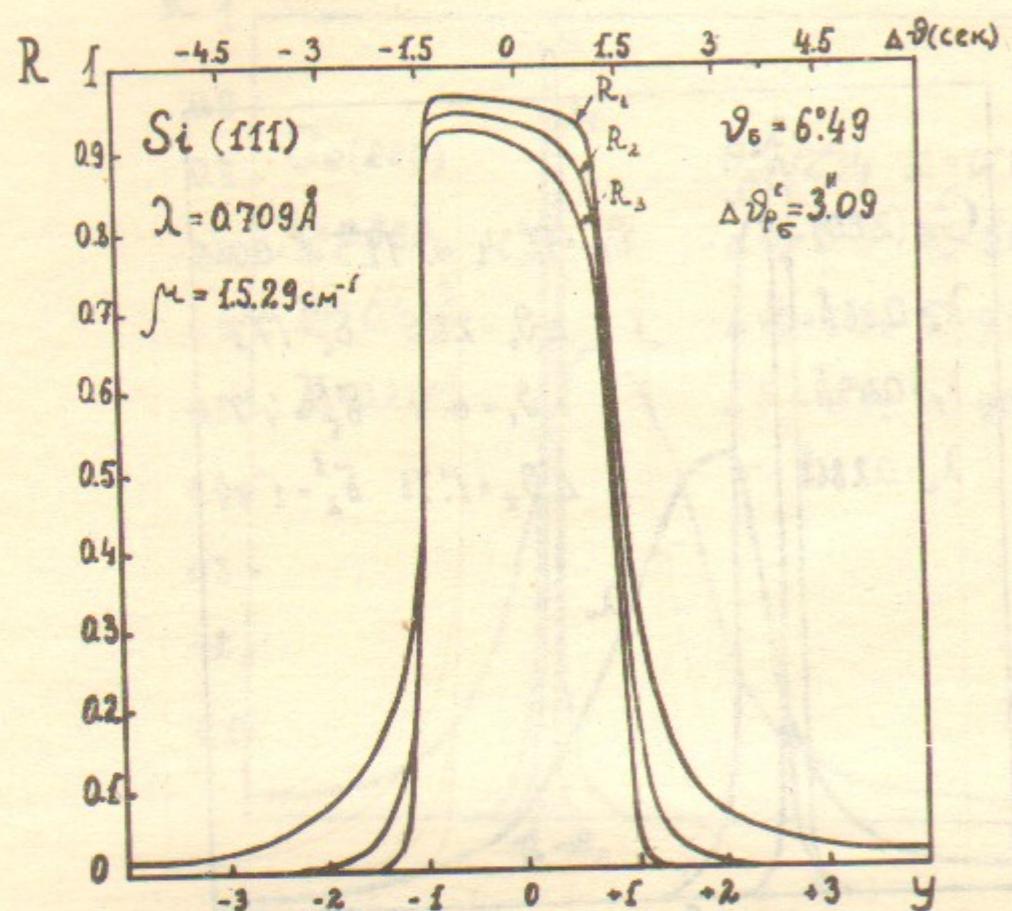


Рис.8. Кривые дифракционного максимума для одно, двух и трехкратного отражений от моноблочного кремниевого кристалла (III).

- 24 -

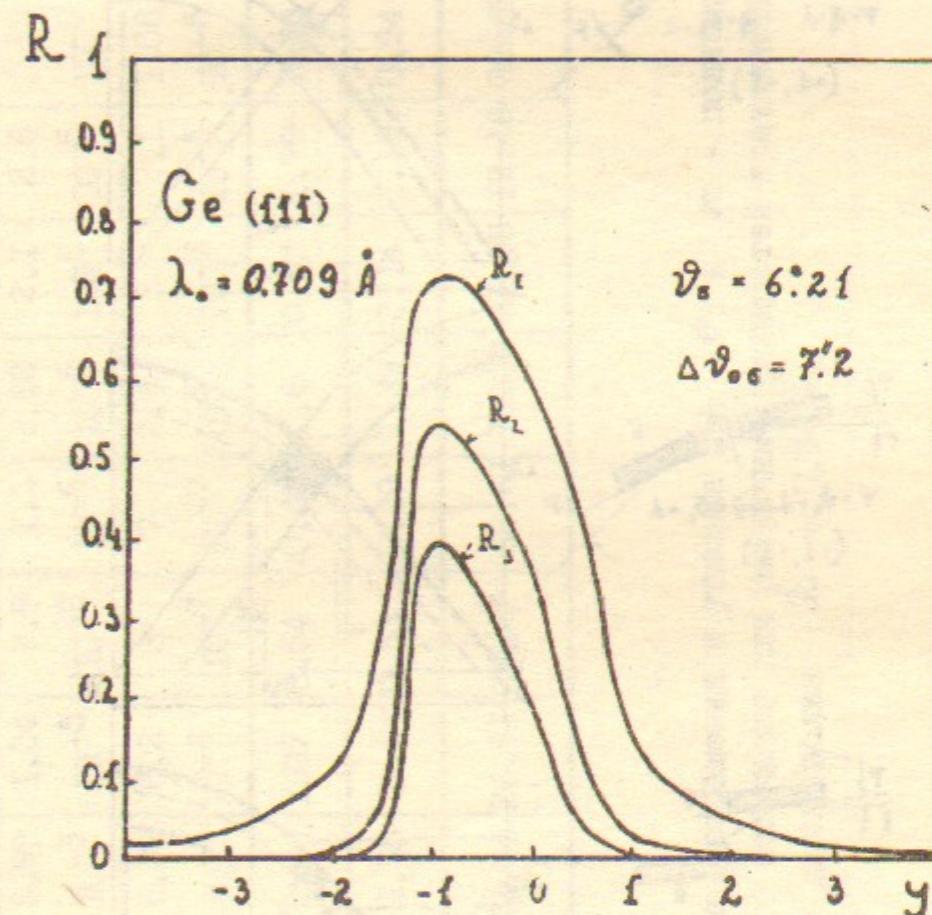


Рис.9. Кривые дифракционного максимума для одно, двух и трехкратного отражений от моноблочного германьевого кристалла (III).

- 25 -

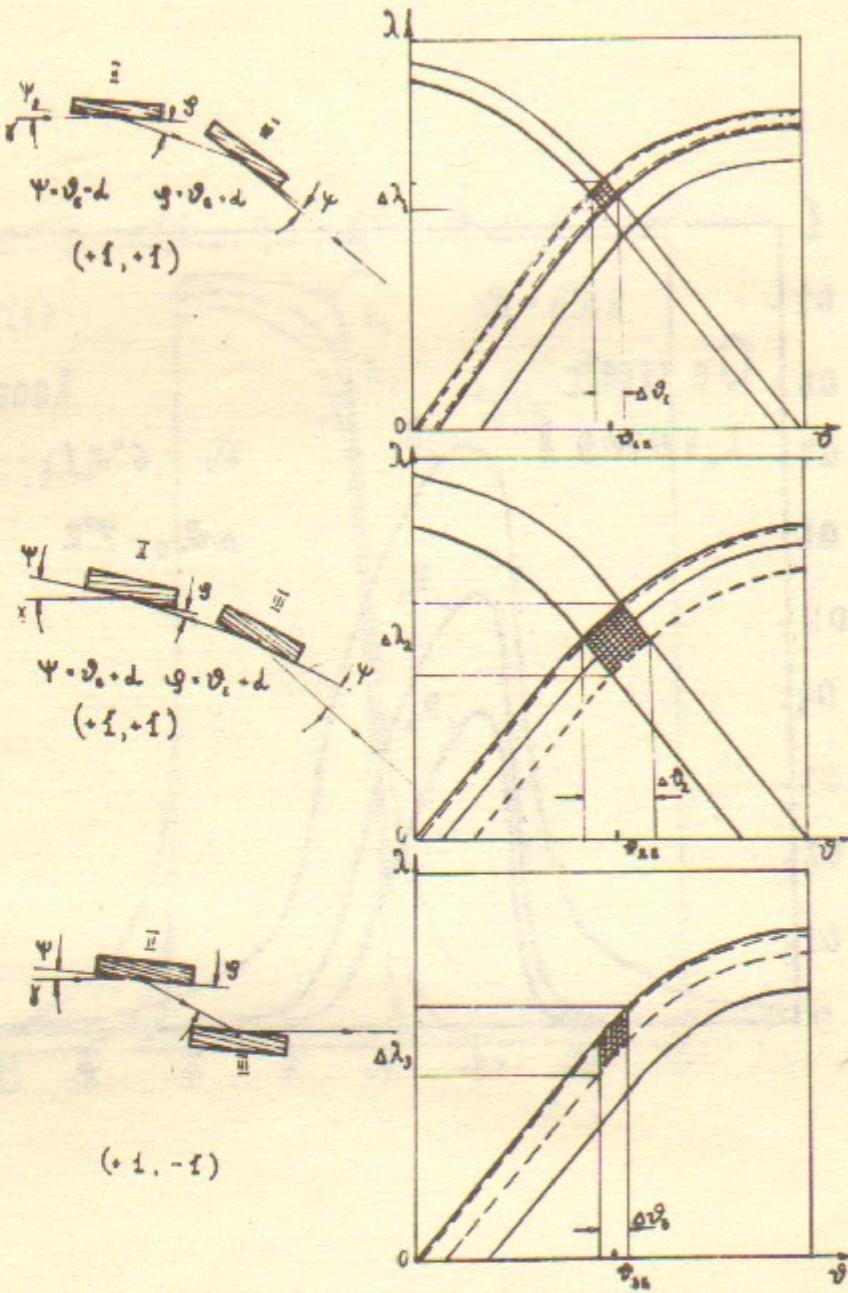


Рис. 10. Варианты расположения кристаллов с сильной асимметрией в схемах с максимальной и нулевой дисперсиями.

- 26 -

$h k \ell$	III	333	444	555	220	440	660	880	311	933	400	422	331	840
$(\frac{\Delta E}{E})_s$	1.33	9.3	3.7	1.9	5.99	1.04	2.9	1.2	2.88	2.1	2.6	1.55	1.48	2.18
$(\frac{\Delta E}{E})_x$	10^{-4}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-6}
$(\frac{\Delta E}{E})_y$	1.28	6.1	1.5	1.0	5.39	6.2	3	7	2.5	5	2.1	1.08	1.1	6.75
$\Delta \vartheta_s$	10^{-4}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-7}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-9}
$\Delta \vartheta_x$	3.79	0.86	0.49	0.37	2.84	1.07	0.54	0.49	1.6	0.57	1.79	1.35	1.12	0.46
$\Delta \vartheta_y$	3.65	0.57	0.19	0.022	2.55	0.64	0.53	0.29	1.39	0.14	1.43	0.94	857	0.001
ϑ_b	$7^{\circ}88$	$24^{\circ}29$	$33^{\circ}27$	$43^{\circ}29$	12.94	26.61	42.21	63.61	15.22	51.98	12.46	22.82	20.19	45.09
(ρ_{ag})														

Таблица I. Энергетические разрешения и угловые ШВ σ и π - поляризаций рентгеновского излучения для различных плоскостей кремниевых кристаллов на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$.

$\hbar k \ell$	III	333	444	555	220	440	660	880	311	933	400	422	331	840
$(\frac{\Delta E}{E})_{\sigma}$	2.98	1.95	8.7	4.5	1.33	2.18	6.8	2.8	6.25	3.8	5.56	3.05	3.09	6.85
$(\frac{\Delta E}{E})_{\pi}$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-6}
$(\frac{\Delta \vartheta}{\vartheta})_{\sigma}$	2.88	1.35	3.9	6	1.2	1.38	1.2	1.3	5.46	5	4.54	2.21	2.42	5.7
$(\frac{\Delta \vartheta}{\vartheta})_{\pi}$	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-5}	10^{-7}
$\Delta \vartheta_{\sigma}$	8.14	1.72	1.11	0.81	5.99	2.14	1.17	0.95	3.35	0.91	3.64	2.5	2.23	1.3
(сек)														
$\Delta \vartheta_{\pi}$	7.86	1.19	0.49	0.11	5.45	1.35	0.2	0.44	2.9	0.12	2.97	1.8	1.74	0.107
(сек)														
ϑ_{σ}	7.53	23.17	31.64	40.98	12.34	25.36	39.98	58.95	14.55	48.89	17.63	21.78	19.27	42.63
(рад)														

Таблица 2. Энергетические разрешения и угловые ШВ σ и π - поляризаций рентгеновского излучения для различных плоскостей германниевых кристаллов на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$.

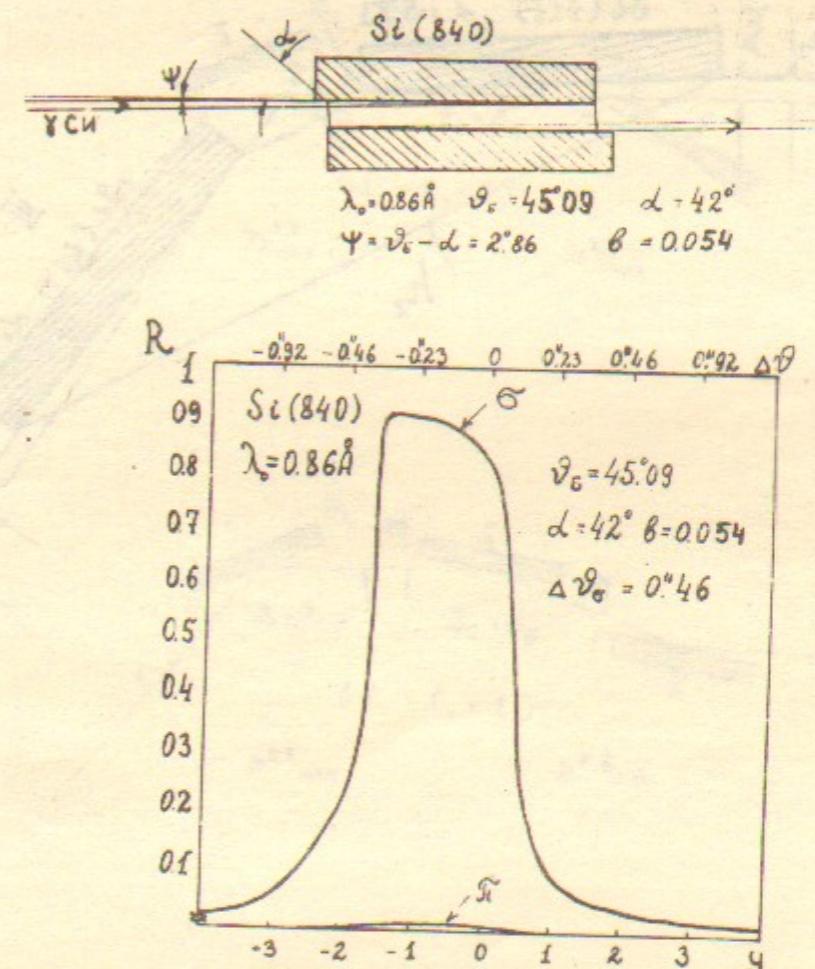


Рис. II. Кремниевый кристалл-поляризатор, вырезанный вдоль плоскости (840). Кривые дифракционного максимума рассчитанные для $\sigma_{\text{о}}$ и π поляризации на длине волны $\lambda = 0.86 \text{ \AA}$.

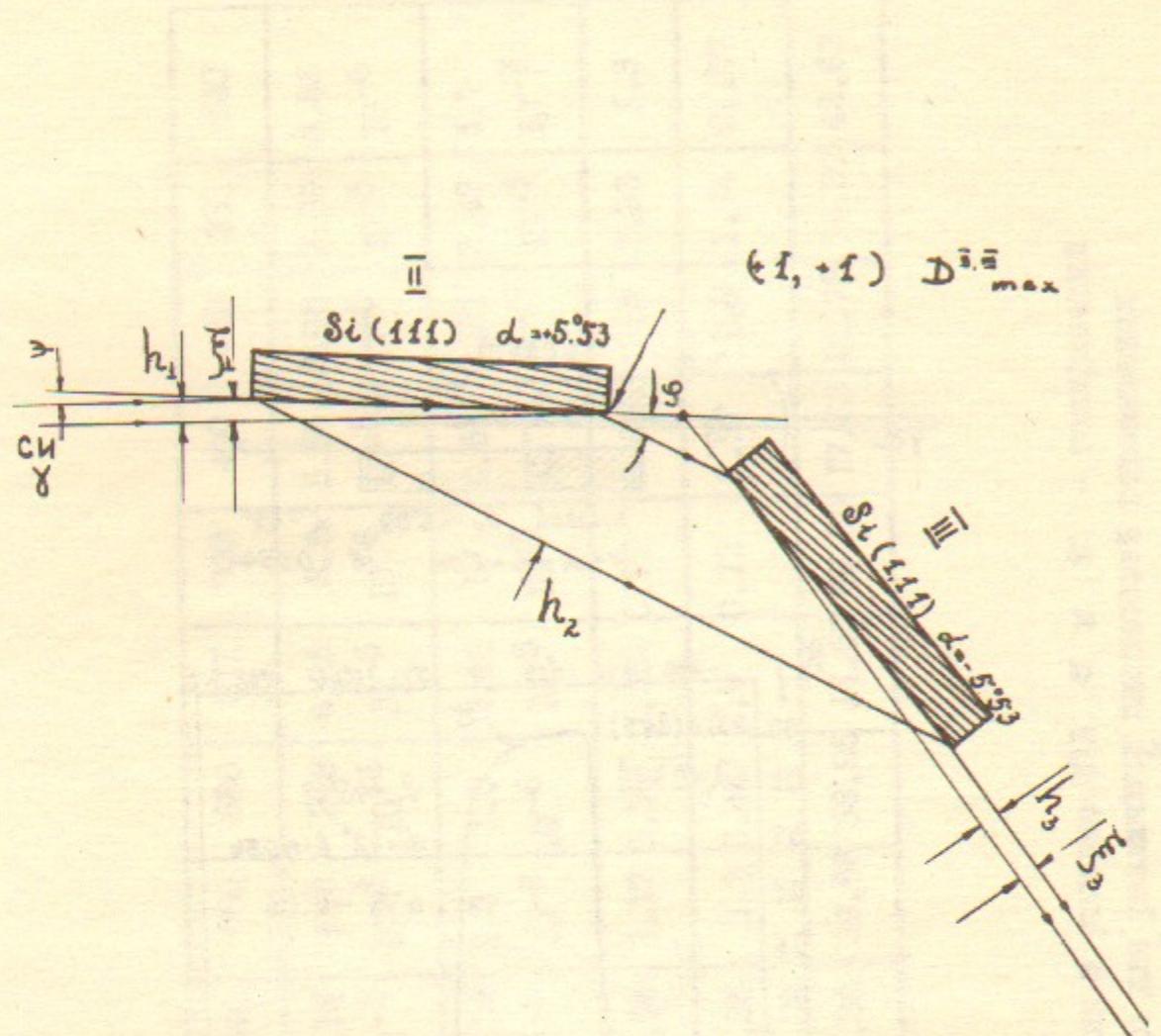


Рис.12. Схема с максимальной дисперсией, обладающая энерг. высоким разрешением и, реализованная в двухкристальном монокроматоре.

- 30 -

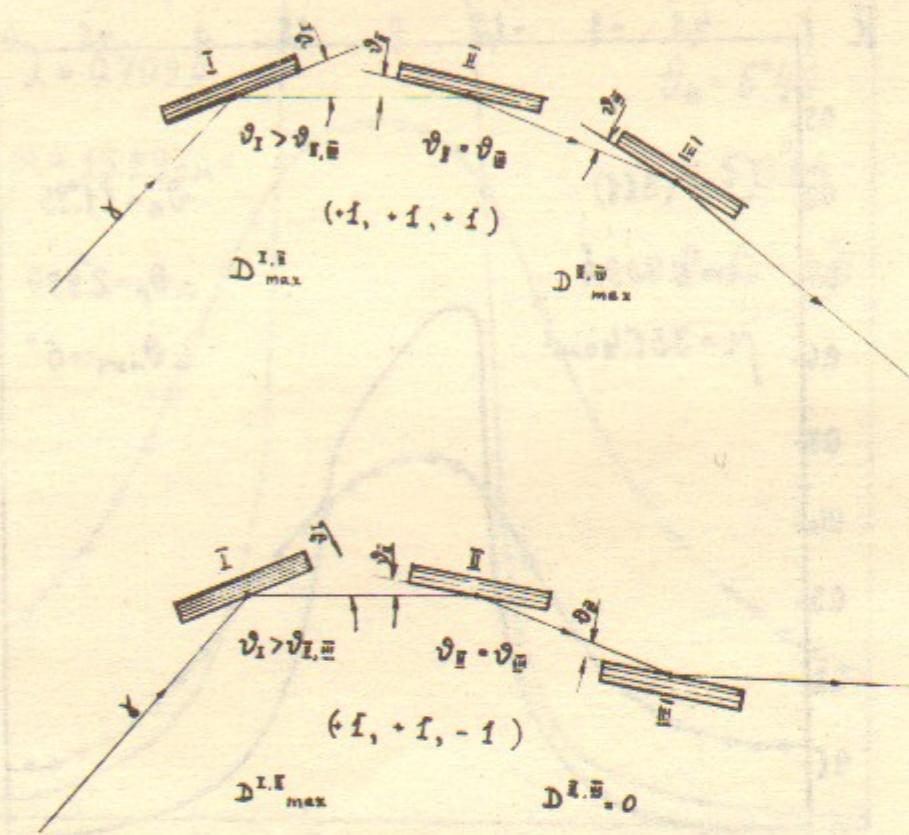


Рис.13. Два варианта монохроматизации рентгеновского пучка с использованием трехкристальной схемы .

- 31 -

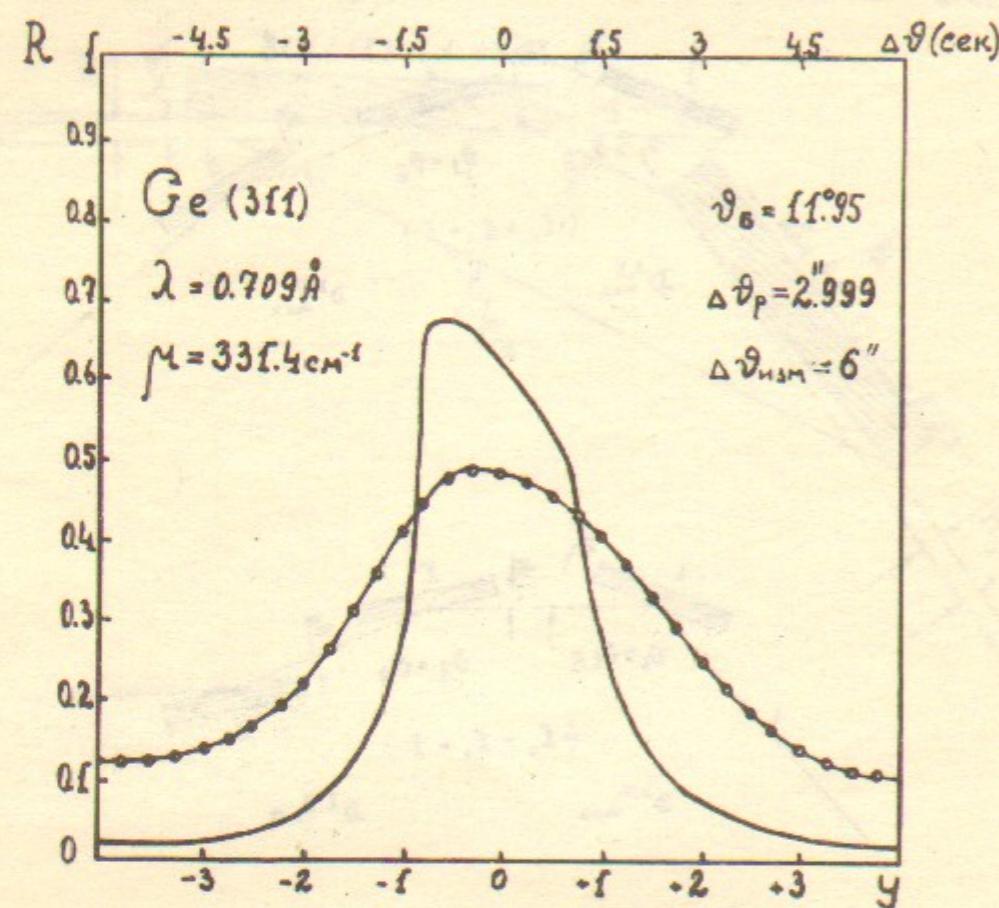


Рис.14. Сравнение "кривой качания", полученной от Ge кристалла в схеме (+I,+I,+I) с рассчитанной кривой дифракционного максимума для идеального поглощающего кристалла на длине волн $\lambda = 0.709 \text{ \AA}$.

- 32 -

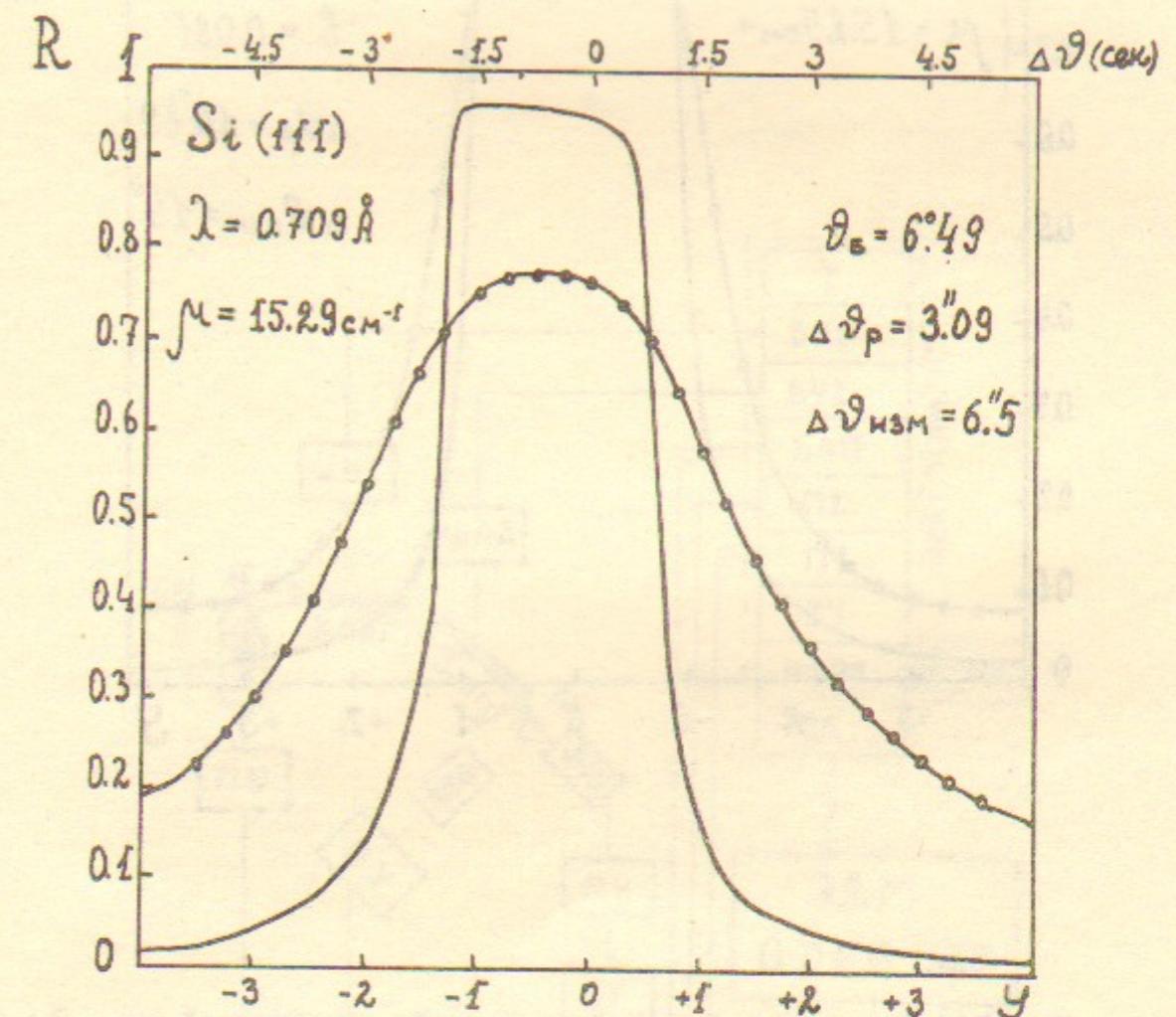
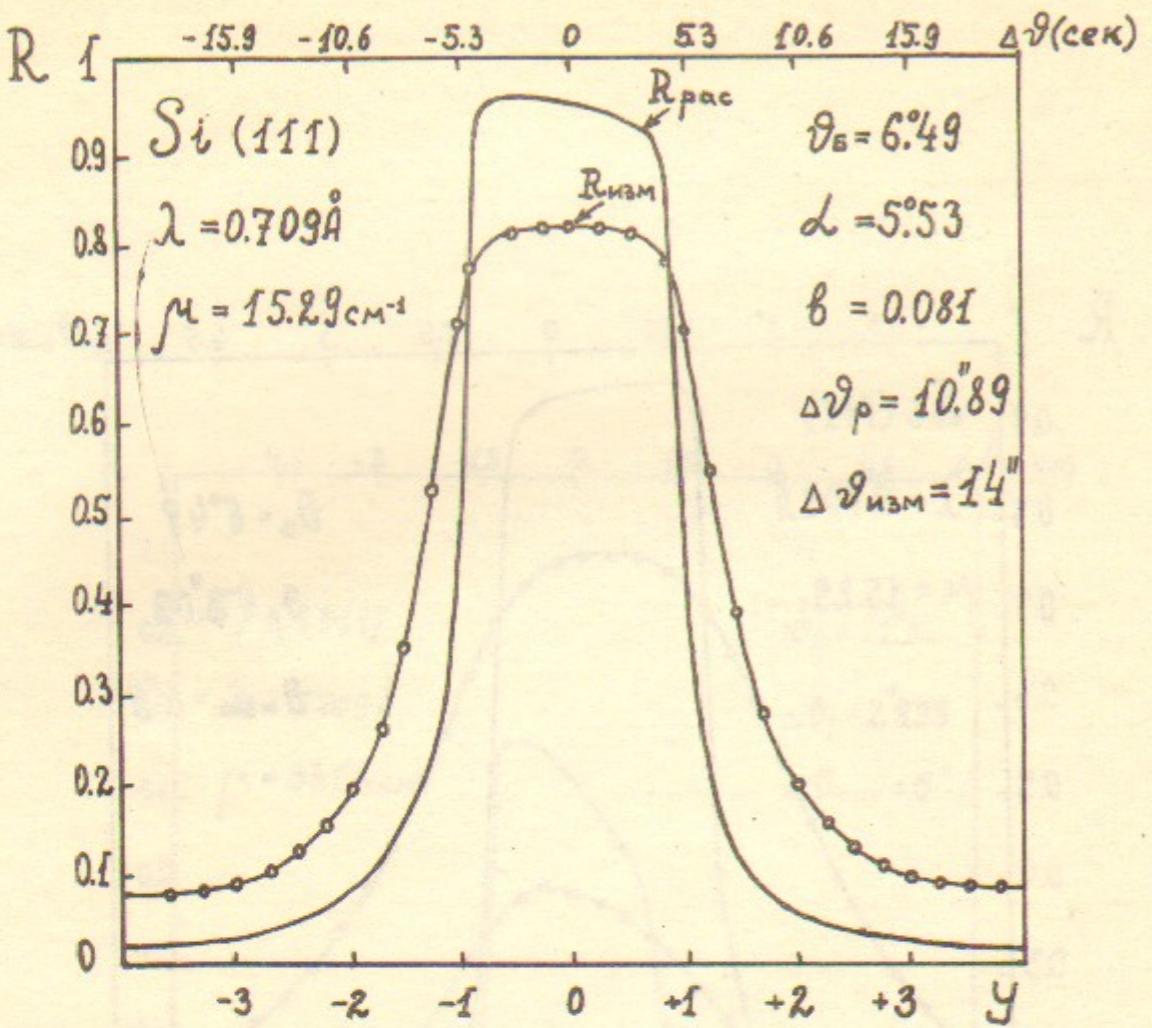


Рис.15. Сравнение "кривой качания", полученной от Si кристалла (III) с рассчитанной кривой дифракционного максимума для идеального поглощающего кристалла.

- 33 -



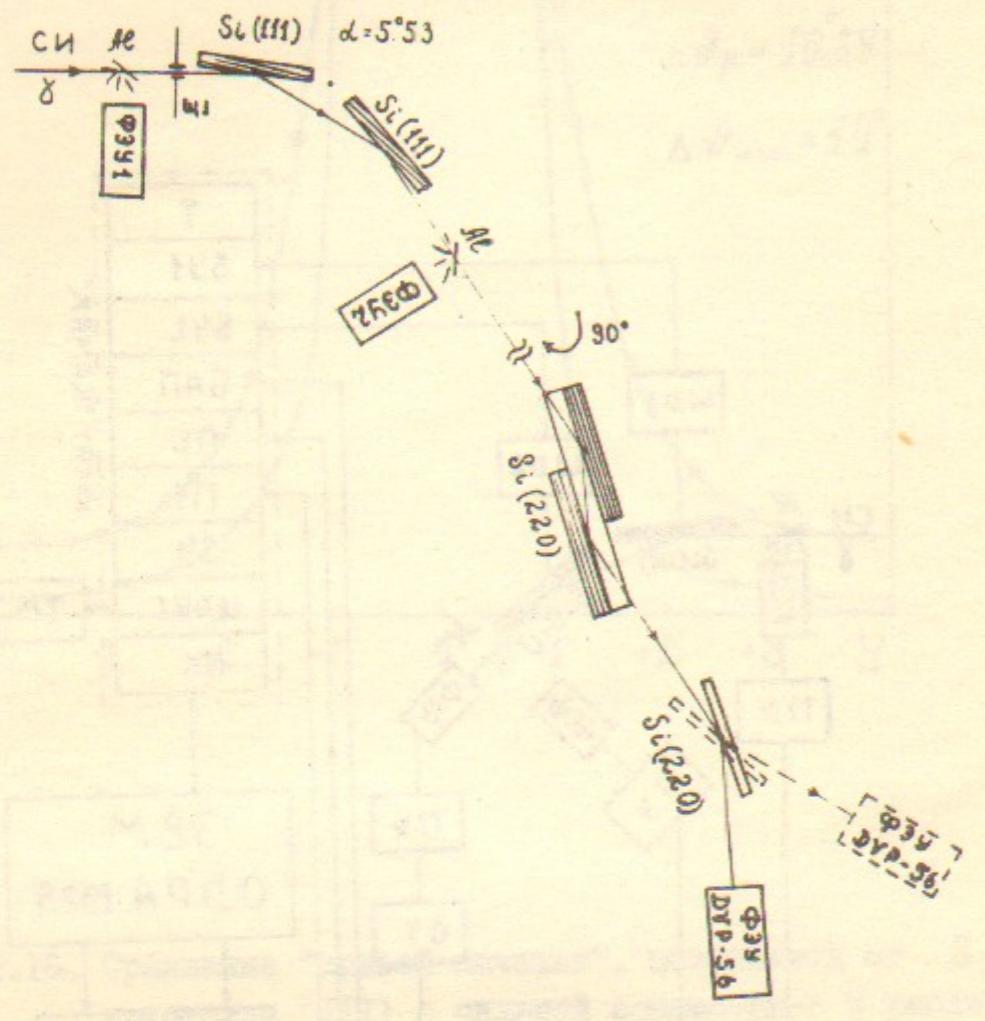


Рис.18. Схема измерения тепловых уходов двухкристального монохроматора на пучке СИ.

- 36 -

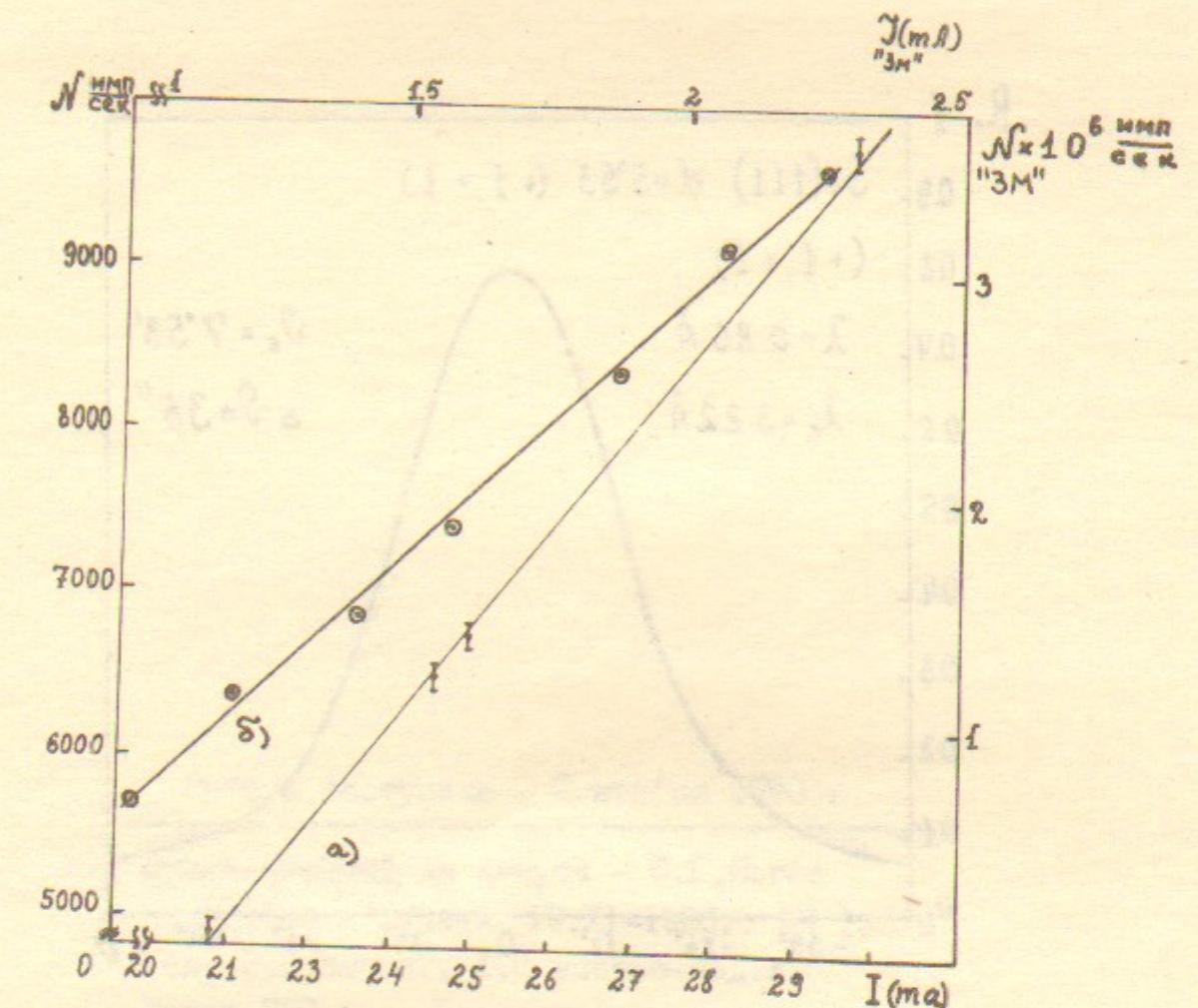


Рис.19. Зависимость интенсивности дифрагированного пучка СИ (а) и пучка СИ от сверхпроводящей "змейки" (б) от величины тока электронов в накопителе ВЭПЛ-3.

- 37 -

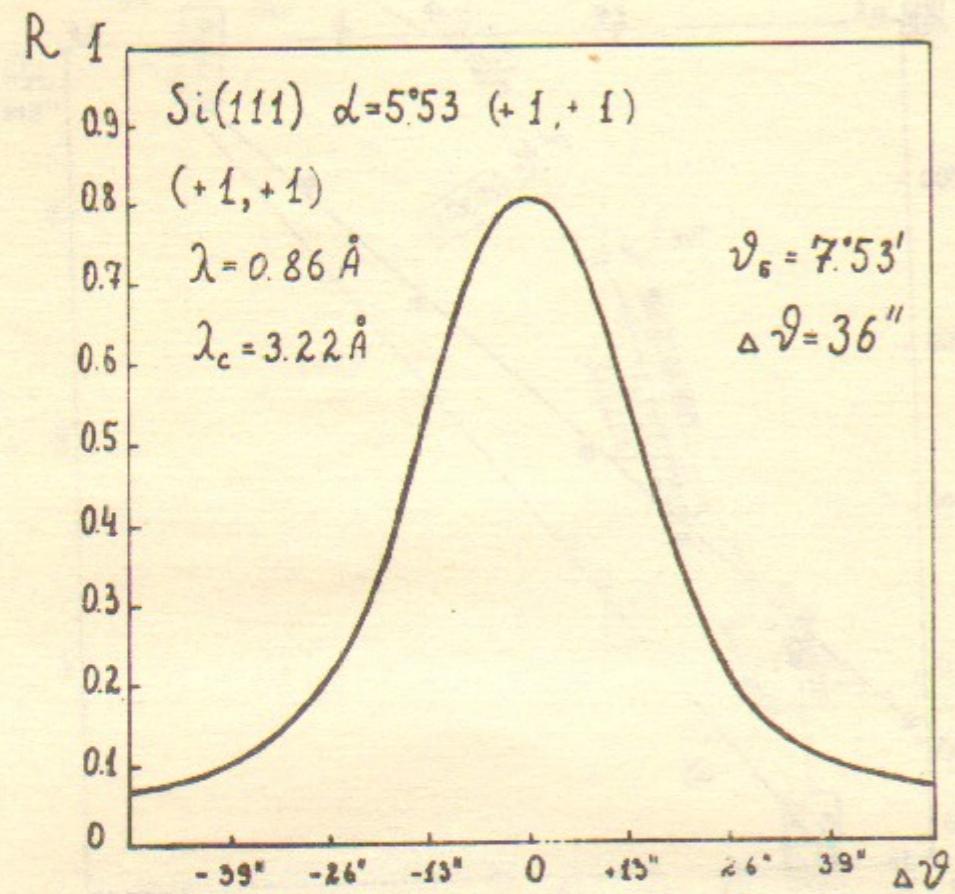


Рис.20. "Кривая качания", полученная при вращении двухкристального монохроматора как целого на пучке СИ.

Работа поступила - 2 ноября 1980 г.

Ответственный за выпуск - С.Г.Попов
Подписано к печати 19.XI-1980г. МН 13539
Усл. 2,3 печ.л., 1,8 учетно-изд.л.
Тираж 250 экз. Бесплатно
Заказ № 204.

Отпечатано на ротапринте ИЯФ СО АН СССР